

Kurzportrait des Prüflabors nanoAnalytics

nanoAnalytics wurde im Jahre 1999 als unabhängiges Prüflaboratorium gegründet und hat sich auf die chemische und morphologische Charakterisierung von Oberflächen und Grenzflächen im Mikro- und Nanometerbereich spezialisiert. Spezifische Vorgaben des Kunden können dabei individuell berücksichtigt werden.



Kompetenz!

- Unser interdisziplinäres Team besitzt langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Oberflächenanalytik. Diese Erfahrung und modernste Analyseverfahren ermöglichen es uns, Ihnen eine kompetente Betreuung zu bieten.

Geschwindigkeit!

- Sie erhalten meist schon innerhalb von drei bis sechs Arbeitstagen nach Auftragseingang Ihr Analyseergebnis. Längere Reaktionszeiten können für umfangreichere oder komplexere Fragestellungen entstehen.
- Für dringende Aufgaben bieten wir einen Eilservice an.

Qualität und Zuverlässigkeit!

- Unsere Tätigkeit wurde von unabhängiger Stelle beurteilt: Wir sind ein durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor. (Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren)
- Unser Qualitätsmanagementsystem entspricht der ISO 9001.
- Die Bearbeitung Ihrer Aufträge erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen.

Vertraulichkeit!

- Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten und Materialien ist für uns selbstverständlich. Wenn Sie es wünschen, kann zusätzlich eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden.



Analyseverfahren bei nanoAnalytics

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die bei uns eingesetzten Analyse- und Präparationstechniken. Die Verfahren sind in der Regel direkt am Standort Münster verfügbar.



Für die Bearbeitung oberflächenanalytischer Fragestellungen werden von uns insbesondere folgende Methoden eingesetzt:

- Rasterelektronenmikroskopie und Röntgenmikrobereichsanalytik (REM / EDX)
- Photoelektronenspektrometrie (ESCA / XPS)
- Sekundärionenmassenspektrometrie (TOF-SIMS)
- Optische Weißlichtprofilometrie
- Rasterkraftmikroskopie (AFM)
- Optische Mikroskopie (Fluoreszenz, Polarisation, DIC)

Ergänzend bieten wir Ihnen auch die folgenden Methoden an:

- Infrarotspektroskopie/-mikroskopie (FTIR / ATR)
- Kontaktwinkelmessungen
- Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
- Nano- und Mikroindentation
- Glimmentladungsspektroskopie (GDOS)
- Sekundärionen-Neutralteilchenmassenspektroskopie (SNMS)
- Mikro-Computertomographie

Spezielle Präparationstechniken

- Cryo-Brüche
- Ultramikrotomanschnitte
(auch unter Cryo-Bedingungen)
- Erstellung von Quer- und Zielschliffen
- Präparation mittels Focussed Ion Beam (FIB)

Weitere Analyse- und Präparationsmethoden auf Anfrage...

